



Actu

Les Actualités du Département

« Instrumentation Scientifique » d'ELEXIENCE

- **Salon EMC 2016 du 28 août au 2 septembre à Lyon**



De l'avis unanime des participants et de nos fournisseurs que nous avons pris le soin d'interroger, EMC 2016 a été un succès. Toutes nos félicitations à l'ensemble de l'équipe en charge de l'organisation.



- **Journée « Science des Matériaux » organisée par Thermo Scientific le 4 Octobre 2016 à Paris**



Pour la bonne forme, nous vous remercions de nous informer de votre participation à ce séminaire : margaux.welch@milexia.fr

Analyser les matériaux organiques et inorganiques

Les matériaux combinés organiques-inorganiques sont à la pointe de la recherche en science des matériaux, depuis l'utilisation de LEDs et FETs organiques aux circuits imprimés jusqu'à l'introduction de graphène et des composites carbonés dans les matériaux du quotidien. Cependant ces composés représentent un défi pour beaucoup de techniques analytiques.

La spectroscopie Raman, infrarouge ou photoélectronique RX, parmi d'autres techniques sont particulièrement utiles pour regarder à la fois organiques et inorganiques.

Ce séminaire d'une journée couvrira plusieurs domaines de la science des matériaux.

Le repas est offert et de larges plages horaires pour des discussions avec nos experts sont réservées.

4 octobre

**Marina de Bercy
Quai de Bercy Aval
75012 Paris
France**

Le séminaire commence à 9h:15

[S'enregistrer](#)

Agenda

- Quelles informations les techniques de spectroscopie vous apportent-elles?
- Comprendre les orientations moléculaires et cristallines
- Caractériser le graphène et d'autres matériaux carbonés
- Analyser les composites et polymères
- Sonder les matériaux multicouches organiques ou inorganiques

Techniques

- Spectroscopie Raman
- Spectroscopie Infrarouge
- Spectroscopie photoélectronique RX
- SEM/EDS
- Extrusion et Rhéologie
- Diffraction RX

Les Nouveaux Produits

- **Thermo Scientific introduit le nouveau système de microanalyse X « Pathfinder »**

***Vitesse d'acquisition et de traitement des données inégalée**, en particulier pour les cartographies élémentaires et de phases quantitatives en temps réel,

***Interface graphique intuitive** assurant la mise en œuvre des fonctions principales rapidement, un choix de configurations logicielles évolutives, adaptées aux besoins et aux contraintes budgétaires,

***Licence site** fournie gratuitement pour l'exploitation des résultats,

***Une large gamme de détecteurs Silicon Drift** (de 10mm² à 100mm²) avec **résolution garantie sur site sur le microscope électronique,**

La plateforme de microanalyse **ThermoPathfinder** fixe de nouveaux standards.

1970's Computerised EDS
Least square fitting

1980's Standardless Analysis
X-Ray linescans
PROZA matrix corrections

1990's LN Free detectors
Spectral Imaging
PhaseID EBSD

2000s Principal Component Analysis
MagnaRay WDS
Quantitative X-Ray Mapping

Now Pathfinder

Tracor Northern
↓
NORAN INSTRUMENTS

KeveX

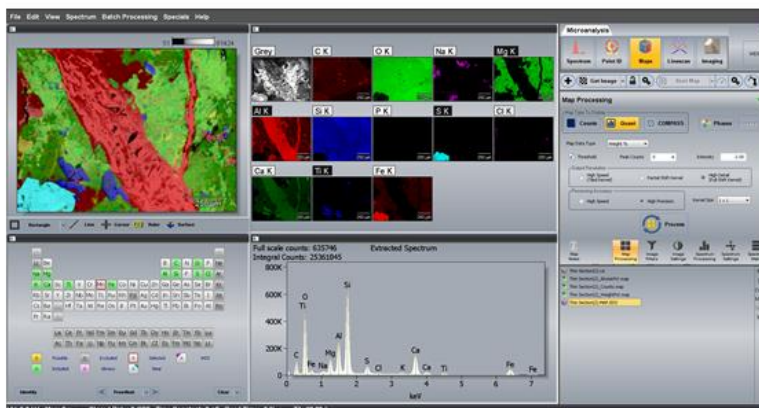
Thermo ELECTRON CORPORATION

ThermoFisher SCIENTIFIC
The world leader in serving science

Pinnacle
Mountaineer Alpine
Pathfinder

Welcome to Pathfinder

The core strengths of Pathfinder reside in its unparalleled Mapping capabilities.



- **AFM PARK NX20 – 300mm : voir toujours plus petit sur des échantillons toujours plus grands**

PARK SYSTEMS complète sa gamme de microscopes à force atomique (AFM).

Le **NX20-300mm** enrichit la **série NX**, qui garantit les plus faibles niveaux de bruit du marché. Le découplage des mouvements X, Y et Z ainsi que le « Mode Non Contact » unique, assurent une parfaite restitution des plus fins détails de surface de l'échantillon, sans l'endommager.



Park AX20 300mm: scans entire sample area of 300 mm wafers using a 300 mm vacuum chuck.

<http://www.microscopy-analysis.com/editorials/editorial-listings/park-systems-launches-300-mm-research-afm>

Pour plus d'informations, retrouvez nous vite sur www.elexience.fr

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification vous concernant. Vous pouvez nous demander la suppression de vos coordonnées en envoyant un email à l'adresse ci-dessous.

Pour en savoir plus



CONTACT

Margaux WELCH

Tel: 01 69 53 80 35

@: margaux.welch@milexia.fr

www.elexience.fr